RoHS対応品(鉛フリー) RoHS Compliance(Lead Free)

Document No: TF-****
Date: 2005/04/27

Page : 1 OF 5

納 入 仕 様 書 SPECIFICATIONS

受領印欄 Approved by

Messrs.

製 品 名 Product	水 晶 振 動 子 CRYSTAL UNIT
型 名 Type of Holder	CFS-308
公 称 周 波 数 Nominal Frequency	32.768 kHz
貴 社 部 品 番 号 Customer's Parts Number	
弊 社 部 品 番 号 CITIZEN Parts Number	

販売元 シチズン時計株式会社 水晶デバイス事業部 Sales 〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12 CITIZEN WATCH Co.,LTD. Crystal Device Division.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishitokyo-shi, Tokyo, 188-8511, JAPAN

TEL:0424-67-6214 FAX:0424-67-8503

製造元 シチズンミヨタ株式会社 水晶デバイス事業部

Manufacturer 〒389-0294 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-5

CITIZEN MIYOTA Co.,LTD. Crystal Device Division.

4107-5, Miyota, Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano, 389-0294, JAPAN

TEL: 0267-32-3331 FAX: 0267-32-4960

Document No: TF-****
Date: 2005/04/27
Page: 2 OF 5

1. 適用範囲

Scope

本仕様書は、シチズンミヨタ株式会社より納入する、水晶振動子に適用する。 This document contains specifications for the crystal unit to be supplied by CITIZEN MIYOTA Co..LTD.

1.1 本仕様書に疑義が生じた場合、または定めのない事項については、両者協議の上その処置を定めるものとします。

If something defined ambiguously or undefined in document happened, the customer and CITIZEN MIYOTA would discuss and take necessary steps by mutual consent.

- 1.2 本仕様書の内容は保証しますので、試験成績書は添付しません。 Product test data can't be attached to this document.
- 1.3 本製品は生命維持装置等、極めて高い信頼性を要求される用途を前提としてはおりません。 This product is not authorized for use as a critical component in life support devices or systems.

2. 電気的仕様

Electrical Specifications

2.1 公称周波数 32.768 kHz Nominal Frequency

2.2 動作温度範囲 -10~+60

Operating Temperature Range

2.3 保存温度範囲 -40~+85

Storage Temperature Range

2.4 周波数許容偏差 ± 20ppm Max. at 25

Frequency Tolerance

2.5 周波数温度特性 頂点温度 / Turnover Temp.; 25 ± 5

Frequency Tolerance over 温度係数 / Temp.Coefficient: -0.034 ± 0.006ppm / ² Operating Temperature Range

2.8 等価直列抵抗 35k Max. at 25

Equivalent Series Resistance

2.9 絶縁抵抗 500M Min./DC100V ± 15V

Insulation Resistance

3. 試験条件

Test Conditions

3.1 負荷容量 12.5 pF

Load Capacitance 回路調査報告書No.QTF-5216による。

Refer to the inverstigation Report No.QTF-5216

for the circuit condition.

3.2 励振レベル 1 u W Max.

Level of Drive

Document No: TF-*** Date : 2005/04/27 Page : 3 OF 5

4. 機械的試験及び耐環境試験

Mechanical and Environmental Tests

試験	項目	試験条件	規格 No.
Test	Name	Test Conditions	Criteria No
1.機	械的試験 Mechar	nical Tests	
1-1	耐衝擊 Shock	75cmの高さより厚さ3cmの硬質木板上に任意の方向で3回自然落下させる。 Drop 3 times from the height of 75 cm onto hard wooden board with thickness of 3 cm.	А
1-2	耐振性 Vibration	振動周波数10~500 Hz, 全振幅1.5mm, または加速度10G、サイクルタイム 1.5分, X,Y,Z の各方向に 2時間、計6時間の振動を加える。 Vibration Frequency: 10~500 Hz, 1.5mm, full wave, or acceleration 10G, Cycle: 1.5 minutes, Direction: X.Y.Z.	А
1-3	端子引張り強度	Time: 2 hours in each direction, for 6 hours in total. 1本の端子に1.5kg の荷重を加え、30±5秒間保持する。	A·C
1-4	Lead Pull 端子曲げ強度 Bending strength	Weight: 1.5kg, Time: 30±5 seconds. 1本の端子に0.5kgの荷重を加え、振動子本体を 90°まで曲げた後、元の位置に戻す。 引き続き反対方向に 90°曲げた後、元の位置に戻す。(Fig.1 参照) Weight: 0.5kg, Bending Angle: 90 degrees, Bending Count: 2 times.	A·C
1-5	半田付け性 Solderability	RMAフラックスに室温で5±0.5秒浸漬する。230±5 の半田槽に5±0.5秒浸漬する。 (半田浸漬方法はリート線を根元に 2mm までとする。) After applying RMA flux, dip in solder. Dipping Time:5±0.5seconds. Soldering Temperature:230±5 .	D
1-6	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	Dipping Depth: 2 mm from the edge of terminals of samples. 260±5 の半田槽に 10±0.5 秒間浸漬する。 (半田浸漬方法はリート線を根元に 2mm までとする。) Dip in solder. Dipping Time: 10±0.5 seconds. Soldering Temperature: 260±5 . Dipping Depth: 2mm from the edge of lead-wires of samples	В
	気密性 Sealing Tightness	ヘリウム検知式リークティテクターにより測定する。 Leak rate shall be measured by using Helium Leak Detector.	E
	対環境試験 Enviro		
2-1	耐寒性 Storage In Low Temperature	-40 に 240時間非動作放置する。 Expose the sample in an inoperative mode to 240 hours at -40 .	А
2-2	耐熱性 Storage In High Temperature	+85 に 240時間非動作放置する。 Expose the sample in an inoperative mode to 240 hours at +85 .	В
	耐湿性 Humidity	+65 ,95%RH に 240時間非動作放置する。 Expose the sample in an inoperative mode to 240 hours at +65 ,and 95%RH.	В
2-4	熱衝擊 Thermal Shock	-40 ·30分間, +100 ·30分間 を 1サイクル とし、5 サイクル 行う。 Subject the sample to 5 temperature variation cycles at -40 for 30 minutes and +100 for the next 30 minutes in each cycle.	А

規 格 Criteria

- バル	怕 Citiena					
規格No.	規格					
Criteria No.	Criteria					
Α	試験前後の、周波数変化量は±5ppm 以下、等価直列抵抗は規格内にあること。					
	Any variation between the pre- and post-test frequencies shall remain within					
	± 5ppm. The equivalent series resistance shall remain within its specified					
	tolerance range after the post-test.					
В	試験前後の、周波数変化量は±10ppm以下、等価直列抵抗は規格内にあること。					
	Any variation between the pre- and post-test frequencies shall remain within					
	± 10ppm. The equivalent series resistance shall remain within its specified					
	tolerance range, after the post-test.					
С	試験後目に見える破損及び気密性の破壊がないこと。					
	After each test, no visible damage, nor the hermetic seal break down.					
D	浸された部分は、新しい半田で 90% 以上覆われていること。					
	At least 90% of each dipped area shall be covered by fresh solder.					
E	$1 \times 10^{-2} \mu \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s} \text{Max}.$					

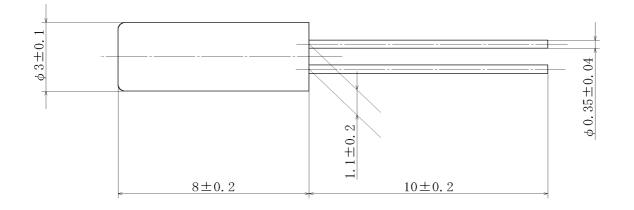
LOAD おもり。 0.5R 1.5mm Fig.1

測定は、 25 ± 2 で行い、各試験後、測定状態に $1\sim2$ 時間放置後測定するものとする。 Measurements should be taken place at 25 ± 2 after each test, the samples shall left at 25 for one to two hours.

Document No : TF-****
Date : 2005/04/27
Page : 4 OF 5

5. 寸法図 Dimensions

unit:mm



6. 印刷仕様 Marking Standards

Sym3

S,3: 当社管理記号

Manufacture's ID Code

y: 製造年 (西暦下1桁)

The last digit of production year.

m: 製造月 (Table 1)

Production month.(See Table 1)

Table 1

Month 月	1	2	 9	1 0	1 1	1 2
Code 記号	1	2	 9	Χ	Υ	Ζ

Document No : TF-****
Date : 2005/04/27
Page : 5 OF 5

7. 梱包

Packing

梱包は輸送中又は、取扱い中に損傷の無い方法であること。 Packing method is taken precautions to prevent damage due to transportation and handling.

8. 製造元

Manufacturer

MASTER CROWN ELECTRONICS CO.,LTD. No.3 BLDG,137,XINXING EN ROAD,WUZHOU,GUANGXI,CHINA. TEL:774-3863148

- * 管理については、シチズンミヨタ株式会社が行う。
- * This manufacture is under the control of CITIZEN MIYOTA CO.,LTD.

9. オゾン層破壊物質について Ozone Depleting Substance (ODS)

本製品(部品/部材)加工、組立等の全工程において、クラス オゾン層破壊物質は使用しておりません。

This Product doesn't use the class ODS at any of production processes, and component parts.